(9日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—136345

DInt. Cl.2 G 02 B 27/17 H 04 N 1/12 識別記号 **②日本分類** 104 A 0

102

97(3) A 22

厅内整理番号 43公開 昭和54年(1979)10月23日

7448-2H

7245-5C 発明の数 1 審査請求 未請求

(全2 頁)

60光走查装置

@特

BZ53-43338 願

@出 昭53(1978) 4 月14日 願

@発 明 者 斎藤勉

> 川崎市幸区小向東芝町 1 東京 芝浦電気株式会社総合研究所内

個発 明 者 森昌文

> 川崎市幸区小向東芝町 1 芝浦電気株式会社総合研究所内

包出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

の代 理 人 弁理士 則近憲佑 外1名

畊

- 1. 発明の名称
- 2. 特許請求の範囲

振動ミラーにレーザ光を照射し、その反射光を 検知することにより削配扱動ミラーによる光点走 意速度の変動を補正する補正光学系を有する装置 において、削配振動ミラーの反射面が入射光の入 射角に応じて異なる光反射率を有することを特徴 とする光走査装置。

8. 発明の詳細な説明

との発明はレーザ光を用いた光走査装置に係り、 特にレーザ光の走査を補正するための補正光学系 を有する光走査装置に関する。

レーザ光を記録情報に応じて変調し、との変調 されたレーザ光により記録部材を走査することに より配録を行なう装蔵はブリンタもしくはファク シミリ装置として実用化されつつある。この種の 装置においてはレーザ光等の光点走査はガルバ鋭 の如き撮動ミラーや回転多面ミラーが用いられて いるが、配録面での配録特性はとの光点走査に大

きく支配されており、光点走査の等選件を保つと とが強く要求されている。とのため光スキャナの 特性が不十分であるときは第1図に示すように補 正光学系を設けて光点走査に応じて記録情報を変 興するタイミングを補正して良い配録特性を得て いる。同凶において、1はレーザ光源、2は配録 情報 A に応じた配録信号を出力する駆動回路、 8 は駆動回路2の出力する記録信号に応じてレーザ 光を変調する光変調器、4はガルパ鏡、5は光変 鯛 器 8 の 出力 し た 変 調 光 が 走 査 記録 さ れ る 配 録 部 材である。更に図示しないレーザ光の光路上に設 けられた光学系とにより配録光学系が構成されて いる。またガルパ鏡もの光点走査の速度の変動を 補正するために、補正用レーザ光源 6 の出力光を ガルパ鏡ものミラー裏面に飛射し、その反射光を 凹面観8を介して光ディテクタ9により検知する。 光デイテクタ9は、スケール7が有する等間隔な 目盛の走査に応じて補正信号 Bを出力し、との補 正信号 B をタイミング信号として慰動回路 2 を助 作させることにより光点走査速度の変動を補正し

ている。しかしながら、第1図に示す方法では、 記録光学系に加えて補止光学系も装置内に収容す るためには大きなスペースを必要とするので装置 の規模が大なるものとなつていた。

との免明は上記事情に鑑みて為されたものであ り、その目的は必要とするスペースが小さくかつ 此コストな補止光学系を有する配録装置を提供す るにある。

第2 図はこの発明の一実施例を示す図である。 同図において11は配録用レーザ光源、12は駆動回路、18は光変調器、14は援動ミラーとしてのガルバ銀、15は記録部材、16は補正用レーザ光源、17は集光レンズ、18は光ディテクタ、19はA/D変換器である。レーザ光源11の出力光は光変調器18によつて記録情報Aに応じた変調を受けたを扱いれる。ガルバ鏡14の反射光に入りで記録部材15が走査されて記録が行なわれる。一方、レーザ光線16の出力光はガルバ鏡14の裏面に入射する。ガルバ鏡14の裏面からの反射光はレンズ17により集光され光ディテクタ18に導かれる。

との際ガルペ競斗の裏面での光反射率が第 8 対に 示すように、入射角に応じて異なる反射率となる ようにしておく。例えばガルパ鏡14の裏面に誘電 体多層膜を形成することによつて容易に入射角に 応じて光反射率が異なる特性を持たせることがで さる。したがつて光ディテクタ18に入射する光の 強度はガルパ鏡の振れに応じて変化しており、そ の出力をA/D変換器19を介してディジタル化され た補正信号Bを作ることができる。この補正信号 Bを必動回路18の動作タイミング信号として用い、 光変調器18を実際のガルバ鏡14の動きに応じたタ イミングで駆動させることにより、ガルバ鏡14の 光点走査速度の変動が補正された記録を行なうと とができる。特にレンズ17は、スキャナの近くに 段嵐するととができ小さな扇口で十分であり、ま た、光ディテクタ18までの光路長も短くできる。

以上のように、この発明によれば簡易な補正光 学系を提供することができ、装置の小型化と低コスト化を実現することができる。なお補正光学系 用のレーザ光源として配録用レーザ光源の出力光

の一郎を分岐させて用いることもできる。「

また、配録時だけでなく光走査による信号脱み 出しにも本免明は適用出来る。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来技術を示す図、第8 図はこの発明の一実施例を示す図、第8 図はこの発明の一実施例で用いられるガルバ錠の光反射特性を示す図である。

- 11,16 --- レーザ光源、
- 18 ------ 光変調器、
- 14 ……ガルパ剱、
- 15 ----- 記錄部材、
- 18 ----- 光ディテクタ、
- 19 ····· A/D 変換器。

(7817) 代型人 弁理士 則 近 意 佑(ほか1名)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

54-136345

(43) Date of publication of application: 23.10.1979

(51)Int.CI.

G02B 27/17 H04N 1/12

(21)Application number: 53-043338

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

14.04.1978

(72)Inventor: SAITO TSUTOMU

MORI AKIFUMI

(54) PHOTO SCANNER

(57)Abstract:

PURPOSE: To make the correction optical system of the scanner simple and miniature by making the reflectance of one surface of a vibrating mirror to values varying according to incident angles.

CONSTITUTION: The back surface of a galvanomirror 14 which forms a scanning vibrating mirror is made to have reflectance of values varying according to incident angles by dielectric multilayer films etc. Hence, letting the correcting laser light be entered to the back surface of the mirror 14 and detecting the degree of its reflection with a photo detector 18 followed by controlling the mirror 14 through an A/D converter 19 or the like enable the fluctuation correction of light spot scanning speed to be performed with the simple and miniature optical system without requiring optical scale and the like.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office